

## СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по докторской диссертации Муслимова А.Э. «Управляемая перестройка поверхности кристаллических подложек для формирования эпитаксиальных наноструктур» по специальности 01.04.18 – «Кристаллография, физика кристаллов».

Полное и сокращенное наименование организации	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)
Организационно-правовая форма и ведомственная принадлежность	Федеральное государственное автономное учреждение Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Место нахождения	Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4
Почтовый адрес организации с указанием индекса	119991 Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4
Телефон с указанием кода города	Тел.: (495)955-00-32, Факс: (499) 236-21-05
Адрес электронной почты	kancela@misis.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	www.misis.ru
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1. M.S. Afanasiev, D.A. Kiselev, S.A. Levashov, V.A. Luzanov, A.A. Nabiyev, V.G. Naryshkina, A.A. Sivov, G.V. Chucheva. The Influence of the Substrate Material on the Structure and Electrophysical Properties of <math>Ba_xSr_{1-x}TiO_3</math> Thin Films // <i>Phys Solid State</i>. 2018. V. 60, N 5. P. 954–957.</p> <p>2. R.N. Zhukov, T.S. Ilina, E.A. Skryleva, B.R. Senatulin, I.V. Kubasov, D.A. Kiselev, G. Suchaneck, M.D. Malinkovich, Y.N. Parkhomenko, A.G. Savchenko. Formation of the microcrystalline structure in <math>LiNbO_3</math> thin films by pulsed light annealing // <i>Jour. Nano – Elec. Phys.</i> 2018. V. 10, N 2. P. 02009.</p> <p>3. K. Shcherbachev, V. Mordkovich, E. Skryleva, D. Kiselev. Influence of the Chemical Activity of Implanted Ions on the Structure of the Damaged Si Layer in SIMOX Substrates. // <i>Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics</i>. 2017. V. 14, N 12. P. 1700137.</p> <p>4. R.N. Zhukov, D.A. Kiselev, K.D. Shcherbachev, M.I. Voronova, S.V. Ksenich, I.V. Kubasov, A.A. Temirov, N.G. Timushkin, M.V. Chichkov, A.S. Bykov, M.D. Malinkovich, Y.N. Parkhomenko. Synthesis and nanoscale characterization of <math>LiNbO_3</math> thin films deposited on <math>Al_2O_3</math> substrate by RF magnetron sputtering under electric field // <i>J. Nano- and Electronic Physics</i>. 2016. V. 8, N 4. P. 04025.</p> <p>5. D.A. Kiselev, R.N. Zhukov, S.V. Ksenich, I.V. Kubasov, A.A. Temirov, N.G. Timushkin, A.S. Bykov, M.D. Malinkovich, V.V. Shvartsman, D.C. Lupascu, Y.N. Parkhomenko. The effect of silicon-substrate orientation on the local piezoelectric characteristics of <math>LiNbO_3</math> films // <i>J. Surf. Investig-X-Ra</i>. 2016. V. 10, N 4. P. 742–747.</p> <p>6. S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, O.N. Sergeeva, D.A. Kiselev, A.A. Bogomolov, A.V. Solnyshkin, E.Yu. Kaptelov, S.V. Senkevich, I.P. Pronin. Pyroelectric and Piezoelectric Responses of Thin AlN Films Epitaxy-Grown on a SiC/Si Substrate // <i>Physics of the Solid State</i>. 2016. V. 58, N 5. P. 967–970.</p>

7. O.V. Varenyk, M.V. Silibin, D.A. Kiselev, E.A. Eliseev, S.V. Kalinin, A.N. Morozovska. Self-consistent modelling of electrochemical strain microscopy in mixed ionic-electronic conductors: Nonlinear and dynamic regimes. // Jour. Appl. Phys. 2015. V. 118, N 7. P. 072015.
8. O.N. Sergeeva, A.A. Bogomolov, A.V. Solnyshkin, N.V. Komarov, S.A. Kukushkin, D.M. Krasovitsky, A.L. Dudin, D.A. Kiselev, S.V. Ksenich, S.V. Senkevich, E.Yu. Kaptelov, I.P. Pronin. SEM, Dielectric, Pyroelectric, and Piezoelectric Response of Thin Epitaxial AlN Films Grown on SiC/Si Substrate // Ferroelectrics. 2015. V. 477. P. 121–130.
9. A. Kleiner, G. Suchaneck, A. Dejneka, L. Jastrabik, V. Lavrentiev, D.A. Kiselev, G. Gerlach. Multitarget Sputtering of Piezoelectric Mixed Oxide Thin Films onto Flexible Substrates // Solid State Phenomena. 2015. V. 230. P. 3–7.
10. R.N. Zhukov, S.V. Ksenich, I.V. Kubasov, N.G. Timushkin, A.A. Temirov, D.A. Kiselev, A.S. Bykov, M.D. Malinkovich, E.A. Vygovskaya, O.V. Toporova. Studying Local Conductivity in LiNbO<sub>3</sub> Films via Electrostatic Force Microscopy // Bull. Russian Academy of Sciences. Physics. 2014. V. 78, N 11. P. 1223–1226.
11. D.A. Kiselev, R.N. Zhukov, A.S. Bykov, M.I. Voronova, K.D. Shcherbachev, M. D. Malinkovich, Yu.N. Parkhomenko. Effect of Annealing on the Structure and Phase Composition of Thin Electro-Optical Lithium Niobate Films // Inorganic Materials. 2014. V. 50, N 4. P. 419–422.
12. D.A. Kiselev, R.N. Zhukov, S.V. Ksenich, A.P. Kozlova, A.S. Bykov, M.D. Malinkovich, Yu.N. Parkhomenko. Investigation of the ferroelectric properties and dynamics of nanodomains in LiNbO<sub>3</sub> thin films grown on Si (100) substrate by scanning probe microscopy techniques. // Thin Solid Films. 2014. V. 556. P. 142–145.
13. R.N. Zhukov, A.S. Bykov, D.A. Kiselev, M.D. Malinkovich, Yu.N. Parkhomenko. Piezoelectric properties and surface potential behavior in LiNbO<sub>3</sub> thin films grown by the radio frequency magnetron sputtering // J. Alloys Comp. 2014. V. 586. P. S336–S338.
14. E.A. Skryleva, I.V. Kubasov, Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev, B.R. Senatulin, R.N. Zhukov, K.V. Zakutailov, M.D. Malinkovich, Yu.N. Parkhomenko. XPS Study of Li/Nb Ratio in LiNbO<sub>3</sub> Crystals. Effect of Polarity and Mechanical processing on LiNbO<sub>3</sub> Surface Chemical Composition // Applied Surface Science. 2016. V. 389. P. 387–394.
15. O.A. Buzanov, M.I. Voronova, E.V. Zabelina, A.P. Kozlova, N.S. Kozlova, E.A. Skryleva, D.A. Spassky, K.D. Shcherbachev. Optical properties, defects, and composition of La<sub>3</sub>Ga<sub>5.5</sub>Ta<sub>0.5</sub>O<sub>14</sub> crystals // Inorganic Materials. 2017. V. 53, N 5. P. 502–509.

Проректор  
по науке и инновациям НИТУ «МИСиС»



\_\_\_\_\_  
(печать организации)

М.Р. Филонов